

| 名称 | メーカー・形式 | 台数 | 仕様・稼働条件 |
|--|-------------------------------------|----|--|
| 冷熱衝撃試験槽 (8台)  | エタック TS100 | 1 | フリ(各種条件対応)制御範囲:-55°C-10°C, 60°C~150°C 槽寸法:W 370mm×H 330mm×D 400mm |
| | エスベック TSA-203ES | 3 | フリ(各種条件対応)制御範囲:-70°C~0°C, 60°C~200°C 槽寸法:650mm×460mm×670mm |
| | エスベック TSA-71H, TSA-73EH | 3 | フリ(各種条件対応)制御範囲:-70°C~0°C, 60°C~200°C 槽寸法:410mm×460mm×370mm |
| | エスベック TSA-73H(高温 300°C) | 1 | フリ(各種条件対応)制御範囲:-70°C~0°C, 60°C~300°C 槽寸法:410mm×460mm×370mm |
| 恒温恒湿試験槽 (10台) | エスベック PH-3KT | 1 | 85°C/85% で条件固定、槽寸法:600mm×850mm×800mm |
| | エスベック PR-4KP | 1 | フリ(各種条件対応)制御範囲:-20°C~100°C 20%~98%Rh 槽寸法:1000mm×1000mm×800mm |
| | エスベック PH-4KT | 1 | フリ(各種条件対応)制御範囲:10°C~100°C 60%~98%Rh 槽寸法:1000mm×1000mm×800mm |
| | エスベック PL-4J | 2 | フリ(各種条件対応)制御範囲:-40°C~100°C(150°C) 20%~98%Rh 槽寸法:1000mm×1000mm×800mm |
| | エスベック SH-221 | 1 | フリ(各種条件対応)制御範囲:-20°C~130°C 30%~95%Rh 槽寸法:300mm×300mm×240mm |
| | エスベック PSL-2KP | 1 | フリ(各種条件対応)制御範囲:-70°C~150°C 30%~98%Rh 槽寸法:600mm×850mm×600mm |
| | エスベック SH-662 | 2 | フリ(各種条件対応)制御範囲:-60°C~150°C 30%~95%Rh 槽寸法:400mm×400mm×400mm |
| | エスベック ARS-1100-J (Hi Power) | 1 | フリ(各種条件対応)制御範囲:-75°C~180°C 10%~98%Rh 上昇:4°C/min 下降:4°C/min(無負荷) 勾配制御:-49.5°C~154.5°C 槽寸法:1100mm×1000mm×1000mm |
| | エスベック ARSF-0800-15 (Hi Power) | 1 | フリ(各種条件対応)制御範囲:-70°C~180°C 10%~98%Rh 上昇:15°C/min 下降:15°C/min(無負荷) 勾配制御:-45~155°C 槽寸法:1000mm×980mm×800mm |
| 恒温試験槽 (15台) | ヤマト科学 DK-400 | 1 | フリ 制御範囲:常温~210°C、槽寸法:400mm×400mm×400mm |
| | ヤマト科学 DF610 | 2 | フリ 制御範囲:常温~260°C、槽寸法:600mm×600mm×600mm |
| | エスベック PH-200 | 6 | 125°C×1台で条件固定 5台はフリ(各種条件対応) 1台 制御範囲:常温~200°C、槽寸法:600mm×600mm×600mm |
| | エスベック PS-222 | 2 | フリ(各種条件対応) 制御範囲:常温~200°C 槽寸法:600mm×600mm×600mm |
| | エスベック ST-120 | 1 | フリ(各種条件対応)制御範囲: 常温~200°C 槽寸法:400mm×280mm×350mm |
| | エスベック IPH-202 | 1 | フリ(各種条件対応)制御範囲: 常温~200°C 槽寸法:600mm×600mm×600mm N2雰囲気可 |
| 低温恒温試験槽 (1台) | エスベック PU-1KTH | 1 | フリ(各種条件対応)-40°C~100°C 槽寸法:500mm×600mm×400mm |
| PCT | エスベック TPC-211 | 1 | 105°C/75%Rh以上 142.9°C/100%Rh以内、飽和、不飽和 併用可 槽寸法:Φ285mm×L320mm(TPC-211) |
| | EHS-220M | 1 | 槽寸法:Φ355mm×L400mm(EHS-220M) |
| リフロー装置 | 日本 AN TOM UNI-8316 | 1 | 加熱 8Zone(max 9Zone) 冷却 3Zone(加熱 max 使用時 冷却2Zone) (遠赤外線併用熱風対流加熱タイプ) 各種Pbフリー条件対応可能 併用可使用基板幅:50~160mm |
| 半田耐熱試験装置 | 大洋電機産業 | 1 | 400°C MAX 半田槽 半田槽寸法:130mm×180mm×60mm |
| 熱抵抗測定装置 | TRM-7110A | 1 | 測定パラメーター:θ _{j-a} 、ψ _{j-t} 測定環境:JEDEC 無風、風速(~4m/s) 測定サンプル:実デバイス、TEG |
| 導体抵抗評価システム | AMR-120-UD | 1 | 印加方式:直流電流方式 チャンネル:Max120ch 測定範囲:1×10 ⁻³ ~1×10 ⁶ Ω 測定精度:10mΩ |
| 振動装置 | IMV VS-2000A-140T | 1 | 最大出力:正弦波 19.6kN(2000kgf)、ランダム波 13.7kNrms(1400kgfrms) 最大加速度:980m/s ² (100G)、最大速度:2.0m/s、最大変位:51mmp-p 振動周波数:5~3000Hz、最大積載質量:300kg、加振方向:上下 |
| | IMV VS-103-200 | 1 | 最大出力:正弦波 9.8kN(1000kgf)、ランダム波 6.86kNrms(700kgfrms) 最大加速度:1020m/s ² (100G)、最大速度:2.0m/s、最大変位:51mmp-p 振動周波数:5~3000Hz、最大積載質量:140kg、加振方向:上下 |
| 衝撃装置 | AVEX SM-110-MP | 1 | 発生波形:正弦半波、衝撃加速度:98~49000m/s ² (10~3000G) 衝撃作用時間:0.1~60ms、最大積載質量:90kg |
| 小型電波室(EMI) | 3m 法小型電波室 | 1 | 室内寸法:7.0m×3.0m×3.2m、扉寸法:1.2m×2.0m、測定周波数:30~1GHz アンテナ昇降:1.0~2.0m、ターンテーブル:φ1.2m(耐荷重 250kg)、電波吸収:7タイプ |
| 自動光学測定器 | TOPCON BM-5A(色彩輝度計) | 1 | 測定角:0.1/0.2/1/2° 切換式、分枝感度特性:CIE1931 等関数に近似 測定範囲:0.0001~1,200,000cd ² 、測定距離:520mm~∞ 輝度精度(°):±4% of rdg、色度精度(xy):±0.005 以内 |
| | TOPCON SR-UL1R(分枝放射計) | 1 | 測定角:0.1/0.2/1/2° 電動切換式 測定範囲:0.005~300,000cd ² 、測定距離:350mm~∞ 輝度精度(°):±2%以内、色度精度(xy):±0.002 |

| 名称 | メーカー・形式 | 台数 | 仕様 |
|----------------------------|-----------------------------|----|--|
| 実体顕微鏡 | ライカ Z16 APO | 1 | 観察倍率: ×3.6~×230 撮影装置: デジタル高精細画像・電子ファイル形式 |
| | オリンパス SZH10 | 1 | 観察倍率: ×3.5~×140 |
| 金属・透過型顕微鏡 | ニコンエクリプス LV100D・ME600L | 3 | 観察倍率: ×25~×1500 撮影装置: デジタル高精細画像・電子ファイル形式 |
| | オリンパス BX60MF5 | 1 | 観察倍率: ×37.5~×990 撮影装置: デジタル高精細画像・電子ファイル形式 |
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス VHX-6000 | 1 | 観察倍率: ×0.1~×2000 撮影装置: デジタル高精細画像・電子ファイル形式 傾斜角度: ±90度 |
| 測定顕微鏡 | オリンパス STM-MJS | 1 | 観察倍率: ×50~×800・最少0.5μmのX-Y-Z測長が可能 |
| マルチフォーカスX線CT装置 | エクストン・インターナショナル Cheetah EVO | 1 | 透視観察: ナノ・マイクロ・ハイパワー CT スキャン: 直行+斜めCT搭載 観察倍率: ~×3000 焦点寸法: 最小0.3μm 管電圧: 最大160kV 管電流: 最大1mA 撮像素子: FPD 16bit 100万画素 ステージサイズ: 460×410mm サンプル重量: 最大5kg |
| マイクロフォーカスX線装置 | 島津製作所 SMX-160LT | 1 | 観察倍率: ×5~×2700 焦点寸法: 最小0.4μm 管電圧: 最大160kV 管電流: 最大0.3mA 撮像素子 I-I 管 8bit 40万画素 ステージサイズ: 350×300mm サンプル重量: 最大2kg |
| 超音波探査映像装置 (SAT) | 日立建機ファインテック HYE-FOCUS II | 1 | 走査範囲: 340×340×50mm 最大倍率: 1000倍 最小走査ピッチ: 0.5μm 256表示階調 プローブ: 25,50,75,140,230MHz |
| レーザーパッケージ開封装置 | Laser Decap PRO | 1 | レーザー方式: Nd:YVO4レーザー 波長: 1,064nm 定格出力: >9W パルス周波数: 0~200kHz 加工範囲: 200×200mm |
| パッケージオープナー (自動開封装置) | 日本サイエンティフィック PA-103 | 1 | 使用薬品: 発煙硝酸 開封可能パッケージ: プラスチックモールド 開封温度 50°C~80°C 時間設定: 0~59分59秒 |
| 試料切断装置 | リファインテック RCA-005 | 4 | ダイヤモンド切断ホイールΦ5インチ使用 |
| | BUEHLE アイソメット 2000 | 1 | ダイヤモンド切断ホイールΦ6インチ使用 |
| 試料研磨装置 | ALLIED マルチフレップ® 6 | 4 | 研磨ディスク: 12インチ 回転数: 10~350rpm で5rpm 毎に可変 |
| | BUEHLER エコメットツイン | 1 | 研磨ディスク: 8インチ 回転数: 10~350rpm で10rpm 毎に可変 |
| | ポリシステム PS-2000 | 2 | 研磨ディスク: 200mm 回転数: 10~200rpm 無断変速 |
| | 丸本ストラス ロボール 25 | 1 | 研磨ディスク: 250mm/2枚 回転数: 40~600rpm で無断変速 |
| クロスセクションポリリッシャ | JEOL SM-09020CP II | 1 | イオン加速電圧: 2~6V イオンビーム径: 500μm(半値幅) 最大搭載試料サイズ/ミリングスピード CP: 幅11mm×長さ10mm×厚さ2mm/100um/H ミリング: 幅20mm×長さ20mm×厚さ3mm/4um/H 試料移動範囲: X軸: ±3mm、Y軸: ±3mm 試料角度調整: ±5度 |
| ディンプルグラインダー | GATAN Model656 | 1 | 初期試料厚さ: 200μm以下 最終試料厚さ: 5~10μm 研磨ホイール径: 15mmφ 研磨ホイール速度: 0~600rpm |
| 電界放出(放射) 走査型電子顕微鏡 (FE-SEM) | 日立 SU8000 | 1 | 【SEM】: 二次電子像分解能: 1.0nm・加速電圧: 0.1kV~30kV 倍率: ×30~×800,000・試料サイズ: Φ100mm 二次検出器: Top/Upper/Lower SE(二次電子)・BSE-H(組成情報)・BSE-L(組成+凹凸情報) |
| | HORIBA EMAX x-act250 | 1 | 【EDX】: 検出元素範囲: B(5)~U(92) 検出器: シリコン・リチウム・ドリフト型・分解能: 137ev以下 その他: 定性分析、カラーマッピング機能、 定量分析(1%未満分析可能)、多点・線分析 |
| 走査型電子顕微鏡 (SEM) | 日本電子 JSM-IT200 | 1 | 【SEM】: 高真空モード分解能: 3.0nm(30kV)、8.0nm(3kV)、15.0nm(1.0kV) 低真空モード分解能: 4.0nm(30kV 反射電子検出器) 倍率: ×5~×300,000 試料サイズ: Φ150mm×H48mm 【EDX】: 検出元素範囲: Be(4)~U(92) 検出器: シリコン・ドリフト型 分解能: 130ev以下 その他: 元素マップ、スペクトル分析、線分析 |
| ドライエッチング装置 | 日本サイエンティフィック ES373 | 1 | 高周波出力: 20~100W 電極間距離: 30mm シーケンス動作: 全自動 使用真空度: 5~80Pa プロセスガス: CF4,O2,他 ステージ温度範囲: 30°C~50°C エッチング時間: 0~99min59sec |
| ボンドテスター | ザイズテック CondorSigma | 1 | ボンディングワイヤ(Au・Cu・Al) プル・シアテスト対応 ロードセル: 100gf、10kgf 測定誤差: ±0.075% |
| プログラマブルカーブトレーサ | テクロニクス 370B | 1 | ステップ・セネレーター機能搭載 最大ピーク電力 220W, 電圧 2000V, 電流 10A |
| PIND 試験装置 | B&W エンジニアリング BW-LPD-DAQ4000 | 1 | 周波数: 40Hz(27Hz)~260Hz 加速度: 0~20G 衝撃: 1000±200G トランスデューサー: 感度-77.5±3dB ステージ: 2インチ |
| 卓上型精密万能試験機 | 島津製作所 オートグラフ AGS-5kNX | 1 | 負荷容量: 5kN 試験力測定精度: ±1%以内 クロスヘッド(引張ストローク): 1200mm(885mm) 試験空間(テーブル面): 幅420mm×奥行(無限) |